

Comités

Colaboradores

Este evento es organizado por el Centro de Excelencia de Nuevos Materiales en colaboración con la Universidad del Valle, Universidad del Cauca y la Compañía FEI.

Comité Organizador

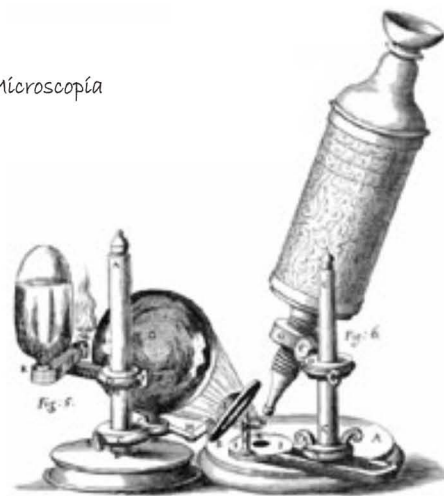
María Elena Gómez, Directora
Universidad del Valle, Cali
Presidente Sociedad Colombiana de Microscopía
(megomez@calima.univalle.edu.co)

Gerardo Andrés Torres,
Universidad del Cauca, Popayán
Vicepresidente Sociedad Colombiana de Microscopía
(gator@unicauca.edu.co)

Luz Stella Gómez,
CSIC, Madrid, España,
Primera Presidente Sociedad Colombiana de Microscopía
(luzgomez@geo.ucom.es)

Comité Local

Carlos William Sánchez
Gerardo Cabrera
Javier López
Juan Gabriel Ramírez Rojas
Julio Cesar Caicedo
Leonid Ipaz
Noralba Martínez



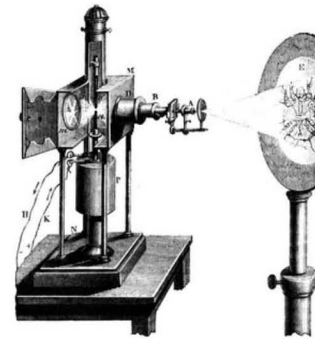
Contactos

Inscripción y Costos

Inscripción:

| | |
|---|---------------|
| Estudiantes pregrado o postgrado | \$ 150.000.00 |
| Profesores | \$ 250.000.00 |
| Miembros de Empresas y entidades de salud | \$ 400.000.00 |

Se ha destinado un espacio para divulgación de trabajos en forma de presentación mural durante el evento, para participar en el libro de resúmenes y de la exposición mural debe enviar un resumen (1 página con gráficos - fuente Arial 10) de su contribución antes del 15 de febrero de 2010. Estas contribuciones estarán consignadas en un libro con ISBN pero no serán sometidos a publicación en ninguna revista nacional ni internacional. El formato



El valor de la inscripción debe consignarse a la cuenta de ahorros No. 3782259160-5 de Bancolombia a nombre del Centro de Excelencia en Nuevos Materiales referencia: Microscopía 2010.



JEOL



FEI™

Calle 13 #100-00, edificio 320 Esp. 1026
Centro de Excelencia en Nuevos Materiales
Cali - Colombia

Tel: (2) 315 35 64 - 339 46 10 EXT. 49
microscopia2010@gmail.com
<http://www.cenm.org/micro2010>

2010 Curso de Microscopía

Principios, avances y nuevas perspectivas
en ciencia de materiales,
en ciencias médicas y biológicas



Santiago de Cali del 25 al 27 de febrero
de 2010, Universidad del Valle



Presentación

Es un placer anunciar el Curso de Microscopía 2010 a desarrollarse en Santiago de Cali, Colombia, entre 25 y 27 de Febrero de 2010. El Comité Organizador está preparando un panel de expertos en temas específicos con el fin de dar a conocer los avances y perspectivas de las técnicas de microscopía, electrónica de transmisión (TEM) y de barrido (SEM); de punta de barrido (SPM de sus siglas en inglés Scanning Probe Microscopy); y confocal a los investigadores, usuarios, estudiantes, principiantes quienes utilizan en su trabajo técnicas de microscopía como herramienta de caracterización en las diferentes instituciones y/o empresas en Colombia.

La participación de Colombia en eventos científicos internacionales sobre microscopía es muy escasa. En la X-Conferencia Interamericana de Microscopía CIASEM 2009, el cual tuvo lugar en Rosario, Argentina, en Octubre de 2009, como un requerimiento del Comité Interamericano de Sociedades de Microscopía Electrónica CIASEM se refundó la Sociedad Colombiana de Microscopía. El objetivo esencial de la junta directiva designada, presidente, profesora María Elena Gómez de la Universidad del valle; vicepresidente, profesor Gerardo Andrés Torres de la Universidad del Cauca, es impulsar el uso de estas técnicas de microscopía y divulgar los avances y sus aplicaciones.

El curso ofrece un programa científico, estimulante y visionario desde los principios básicos de las diferentes microscopías, sus aplicaciones en ciencia de materiales, en ciencias de la vida y los avances en instrumentación y nuevas metodologías. El programa consta de conferencias plenarias y unas sesiones de murales. Los murales tiene la importancia de divulgar los resultados más relevantes de los participantes, y tendrán sesiones de presentación y discusión. Igualmente hemos invitado a firmas y empresas que muestren sus productos y el estado del arte del desarrollo en cada tipo de microscopio en las ciencias de materiales, de la vida y nanotecnología.

| Hora | Jueves | Viernes | Sábado |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 8:00 – 9:00 | Inscripciones | Avanzado TEM 1 (Materiales) | Avanzado TEM |
| 9:00 – 10:00 | Fundamentos Microscopía Electrónica | Avanzado TEM 1 (Biomateriales) | Avanzado SEM |
| 10:00 – 10:30 | Pausa | | |
| 10:30 - 11:30 | Fundamentos SPM | Avanzado SEM Materiales | Avanzado Nanoindentación |
| 11:30 - 12:30 | Fundamentos Confocal | Avanzado SEM Biomateriales | Avanzado confocal |
| 12:30 - 2:00 | Pausa Almuerzo | | Clausura |
| 2:00 -3:00 | Fundamentos ME 2 | Avanzado SPM Materiales | |
| 3:00 – 4:00 | Fundamentos SPM 2 | Avanzado SPM Biomateriales | |
| 4:00 – 4:30 | Pausa | | |
| 4:30 - 5:00 | Preparación de muestras | Avanzado Confocal | |
| 5:00 – 7:00 | Sección de Poster 1 | Sección de Poster 2 | |

Conferencistas Invitados

Conferencista Invitados Confirmados:

- ✦ Armando Lucumí, Colombia
- ✦ Fernando Ponce, USA
- ✦ Francisco Espinoza, México
- ✦ Gladys Ocharan, Perú
- ✦ Gloria Cobaleda, Colombia
- ✦ Humberto Ibarra, Colombia
- ✦ Lía Pietrasanta, Argentina
- ✦ Luis Felipe Jiménez, México
- ✦ Silvia Espinoza, México
- ✦ Susana Peripoli, Brasil

Temas a Tratar

Microscopía Electrónica:
Microscopio Electrónico de Barrido y
Microscopio Electrónico de Transmisión

Microscopía de punta de barrido SPM:
AFM- MFM - EFM - Nanoindentación

Microscopía Confocal

